

【補助事業概要の広報資料】

整理番号 27-14

補助事業名 平成27年度ナノ領域新機能材料等の分析技術の向上と標準化支援補助事業

補助事業者名 一般社団法人研究産業・産業技術振興協会

1 補助事業の概要

(1) 事業の目的

本事業は日本のナノ計測の分野で強みを持つ分析計測手法を取り上げ、日本の分析機関の計測技術の水準を高め、計測ノウハウを共有化し、それら分析技術の国際標準化に貢献することにより国際競争力を高めることを目的とする。そして新規ナノ材料製品の国際市場への投入を継続的にかつ優位に行うこと、ナノ計測手法の測定の信頼性と最先端性によって支援していくことを目的とする。

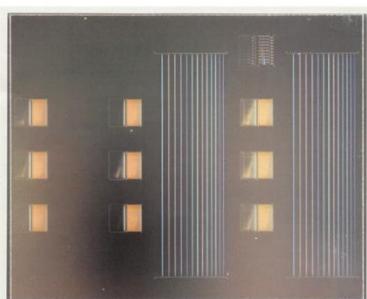
(2) 実施内容

①[JRIA27 ナノ分析標準]ナノ領域元素分析標準化補助事業報告書

http://www.jria.or.jp/activity/result-report/pdf/JKAH27nano_p.pdf

本事業は、ナノ材料の分析について、日本の分析機関の計測技術の水準を高め、計測ノウハウを共有化し、それら分析技術の国際標準化に貢献することにより国際競争力を高めることを目的とする。そして新規ナノ材料製品の国際市場への投入を継続的にかつ優位に行うことと、ナノ計測手法の測定の信頼性と最先端性によって支援していく。

本事業では、走査型電子顕微鏡（S E M）の像解像度評価の標準化に向けた評価方法及び評価用標準物質の開発及び飛行時間測定二次イオン質量分析法（T O F – S I M S）の標準化に向けた基礎検討などを行なうこととして、今後3年間計画の新しいテーマでの初年度活動を開始した。S E Mの像解像度評価の標準化に向けた像シャープネス評価については産業技術総合研究所が試作した試料の評価を行い、次回に試作する試料への指針を得た。T O F – S I M Sの強度軸校正を目的とした試料については0次の仕様検討を行い試作まで行い、次年度に試作する試料に向けての改善指針を得た。



プロトタイプ試料片光学顕微鏡写真



委員会開催風景

2 予想される事業実施効果

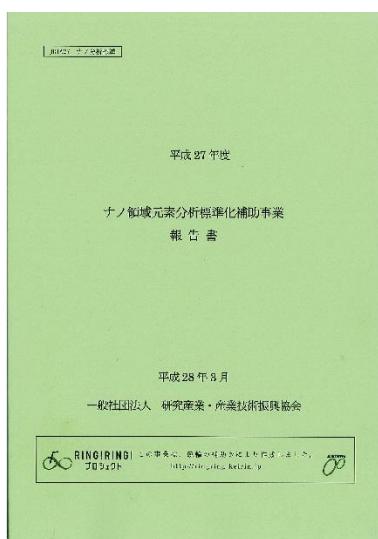
本事業の成果によって提案された標準的な分析手法及び分析技術高度化の検討結果をわが国の検査分析機関に広く周知することによって、国内のナノノレバル分析の該当分野の技術力の強化が図られる。

国際標準化を図ることにより、わが国の検査分析機関が国外諸機関に対していち早く優位なポジションを確保することができるこことがある。

3 補助事業に係る成果物

(1) 補助事業により作成したもの

平成27年度ナノ領域元素分析標準化補助事業報告書



目次

第1章 本事業の実施の背景、目的、体制	- 1 -
第2章 ナノスケール材料の分析技術とその標準化	- 3 -
2.1 分析用試料の選択 (SEMについて)	- 3 -
2.1.1 圧縮応力測定による SEM の選択	- 3 -
2.2 ナノ材料の測定標準化と SEM の標準化	- 13 -
2.2.1 ナノ材料の分類	- 13 -
2.2.2 SEM の 分類、工具と仕様	- 14 -
2.2.3 分析法、評価と本事業の関連	- 14 -
2.3 SEM 評価シートネス標準化	- 18 -
2.3.1 分析前の基準	- 16 -
2.3.2 基準シート	- 17 -
2.3.3 標準化評価法	- 19 -
2.4 第7回貴重二次イオン質量分析 (TOF-SIMS) について	- 20 -
2.4.1 TOF-SIMS の特徴と構造	- 20 -
2.4.2 TOF-SIMS の原理	- 20 -
2.4.3 TOF-SIMS 分析法の構造	- 22 -
2.5 TOF-SIMS の構造とナノ業界の関わり	- 23 -
2.5.1 TOF-SIMS の実用分野における特徴	- 23 -
2.5.2 TOF-SIMS 標準の有機材料標準物質の供給状況	- 26 -
第3章 SEM 評価シートネス基準の標準化	- 27 -
3.1 分析用にされる SEM 評価基準の評価方法	- 27 -
3.1.1 ガンマ線分野	- 27 -
3.1.2 対称用標準物質	- 27 -
3.2 非レーザープラズマ装置局の標準物質の精算原則	- 29 -
3.2.1 標準物質プロトタイプの仕様の検討	- 29 -
3.3 標準物質プロトタイプの品質の評価手順	- 33 -
3.4 標準物質プロトタイプの品質の評価結果	- 35 -
3.4.1 SEM による上層からの检测	- 35 -
3.4.2 FIB-SEI 测定	- 39 -
3.4.3 FIB-TOF 测定	- 44 -
3.4.4 4D 分析	- 36 -
3.5 標準物質プロトタイプの SEM を用いたシートネス評価	- 58 -
3.5.1 DR 法による推シートネス評価手順	- 58 -
3.5.2 推シートネス評価の基準則	- 59 -
3.5.3 評定手順	- 60 -
3.5.4 評定結果	- 61 -
3.6 まとめ	- 73 -

(2) (1) 以外で当事業において作成したもの

該当なし

4 事業内容についての問い合わせ先

団体名：一般社団法人研究産業・産業技術振興協会（ケンキュウサンギョウ・サンギョウギジュツシンコウキョウカイ）

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3-23-1 クロセビア本郷2F

代表者：会長 伊藤 源嗣（イトウ モトツグ）

担当部署：企画交流部（キカクコウリュウブ）

担当者名：小林 一雄（コバヤシ カズオ）

電話番号：03-3868-0826

FAX：03-5684-6340

E-mail：jria1@jria.or.jp

URL：<http://www.jria.or.jp>